

GC/MS • SPECTROMETRIE IR & EOS • FLUORESCENCE X • DIFFRACTION X • MICROSCOPIE • MICROANALYSE EDS

# UNE EXPERTISE GLOBALE EN INSTRUMENTATION SCIENTIFIQUE

FIGURES LIBRES



**Depuis plus de 25 ans, nous apportons au monde scientifique une expertise globale en instrumentation d'analyse et de contrôle.**

Quel que soit votre besoin, vous choisissez parmi les technologies les plus innovantes : spectrométrie IR ou EOS, fluorescence X,  $\mu$ Fluorescence X, GC/MS, Fast GC, diffraction X, microscopies Auger, ESCA, XPS, TOF SIMS et D-SIMS, microscopie AFM, microanalyse EDS ou profilométrie optique.

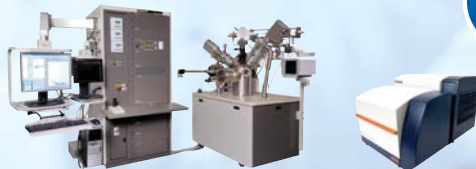
La richesse de notre gamme vous permettra de trouver le matériel adapté à vos applications, qu'il soit portable ou de laboratoire.

Vous bénéficiez d'un engagement de services unique : conseils et supports clients personnalisés, laboratoire d'applications, études de faisabilité, service technique de pointe et maintenance préventive.

Découvrez nos solutions sur  
**[www.fondiselectronic.com](http://www.fondiselectronic.com)**

ou appelez-nous au

**01 34 52 10 30**



**Fondis**  
ELECTRONIC